**Příloha č. 1: Technické podmínky**

SPM mikroskop s možností měření v externím magnetickém poli musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkce | Hodnota (minimální požadavky) | Uchazečem nabízené zařízení(uchazeč uvede příslušnou hodnotu) |
| měřicí módy SPM mikroskopu ve vzduchu | Contact AFM, lateral force microscopy (LFM), Resonant Mode (semicontact, noncontact AFM), Phase Imaging, Magnetic Force Microscopy (MFM), Electric Force Microscopy (EFM), Scanning Kelvin probe microscopy, AFM Litography |       |
| In plane magnetgenerované magnetické pole v rovině vzorku o velikosti  | minimálně 0,1 T (pro velikost mezery 15 mm) |       |
| vyměnitelné pólové nádstavce (in-plane magnet) | **Ano** |       |
| Out of plane magnet |  |  |
| generované magnetické pole ve směru kolmém ke vzorku  | minimálně 0,01 T |       |
| Oba magnety schopny měřit vzorky | o rozměrech 15x15 mm |       |
| Skener |  |  |
| Rozsah skenování:  | alespoň 70x70x7 μm |       |
| Nelinearita v osách xy:   | nejvýše 0,2% |       |
| Nelinearita v ose z:  | nejvýše 2% |       |
|  |  |  |
| Základna systému SPM a přiblížení vzorku |  |  |
| Automatické i manuální přibližování vzorku | **Ano** |       |
| videomikroskop s manuálním zoomem pro optické rozlišení  | minimálně 3 μm |       |
| konektory pro připojení skenerů (měřicích hlav) | **Ano** |       |
|  |  |  |
| SPM kontrolér |  |  |
| kontrola kapacitních senzorů | **Ano** |       |
| počet obrazů zaznamenaných během jednoho skenu  | minimálně 4 obrazů |       |
| maximální délka kabelu mezi měřicí hlavou a kontrolerem  | minimálně 2 m |       |
| Antivibrační systém |  |  |
| zatížitelnost  | minimálně 100 kg |       |
| rozsahy izolace  | dynamická 0,7 - 1000 Hzpasivní nad 1000 Hz |       |

*Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:*

**Výrobce:**

**Typové označení výrobků:**